

御客様各位

アルテック株式会社
情報マネジメント事業部「自動認識総合展」出展のご案内

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

来る2015年9月16日(水)～9月18日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催されます「自動認識総合展」に弊社が出展致します。

弊社では、世界各国のタグメーカーやデザイナーから高い評価を受けている UHF 帯 RFID タグおよびインレイの周波数特性測定および検査装置である Voyantic 社製 Tagformance lite のほか、インライン検査装置 Tagsurance を実機展示およびデモ実演を用いてご紹介します。

御多忙中とは存じますが、是非この機会に弊社ブースに御来臨賜りたくお願い申し上げます。市場競争力を獲得できる新技術をいち早く御紹介させて頂きたく存じます。

開催概要

展示会名	第17回自動認識総合展
会期	2015年9月16日(水)～9月18日(金) 10:00～17:00
会場	東京国際展示場「東京ビッグサイト」西2ホール
展示会 HP	http://www.autoid-expo.com/tokyo/

【出展品一覧】

メーカー名、展示品	内容
Voyantic 社 (フィンランド) パネル、実機デモ	・UHF 帯 RFID タグおよびインレイの周波数特性測定装置 ・UHF 帯 RFID タグおよびインレイのインライン品質検査装置
Micropross 社 (フランス) パネル、実機デモ	・EMVCo/NFC Forum 認定テストソリューション ・EMVCo/NFC Forum に準拠したスパイツール

【お問い合わせ先】

アルテック株式会社

情報マネジメント営業部 上野

E-mail: ueno@altech.co.jp

TEL: 03-5542-6755 / FAX: 03-5542-6766

